



- Azulejo hispano-mourisco de aresta, provavelmente da segunda metade do século XVI
- Origem da produção: Produção portuguesa ou espanhola
- Local: MNAz

**Amostras na Azulejoteca:** Secção polida



## Índice

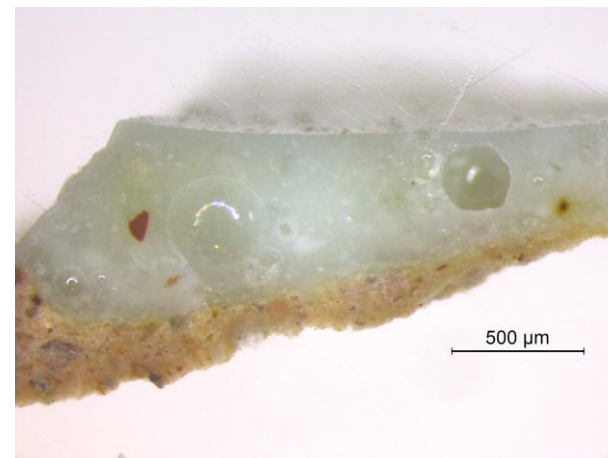
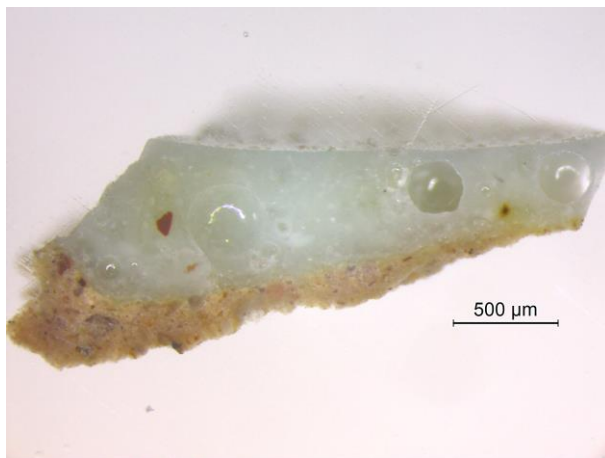
### Caracterização morfológica

- ✓ Imagens de microscopia ótica (OM)
- ✓ Imagens de microscopia electrónica (SEM)

### Caracterização química

- ✓ Análise por SEM/EDS

## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE MICROSCOPIA ÓTICA

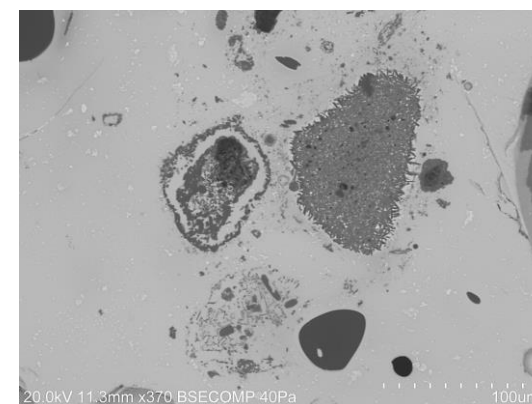
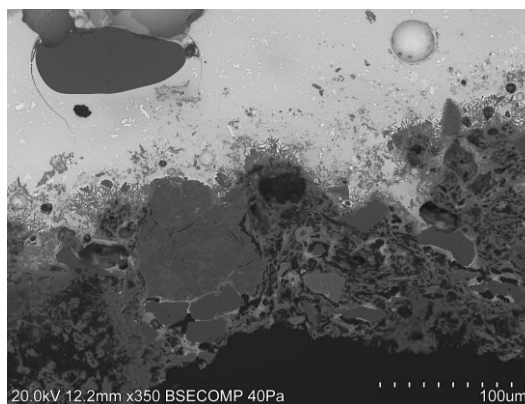
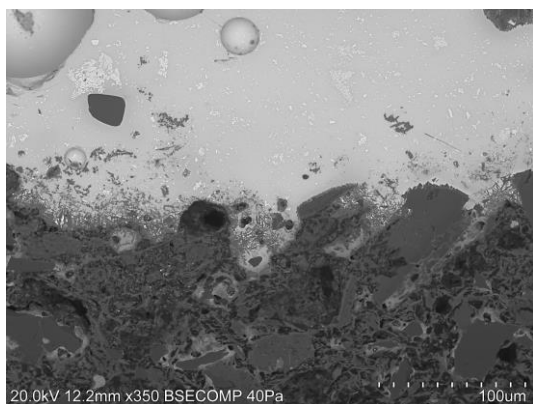
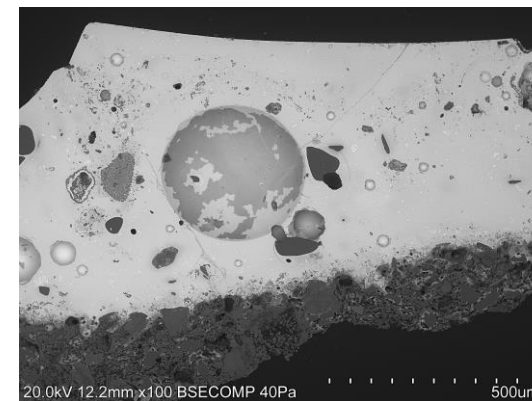
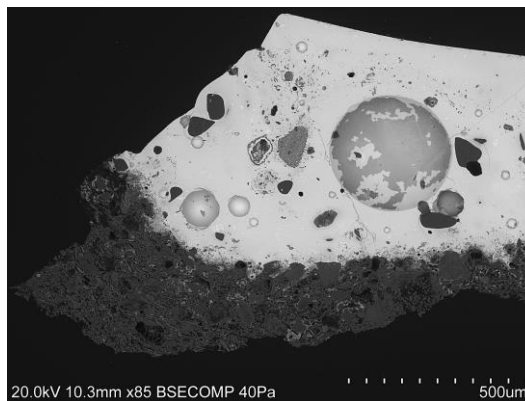
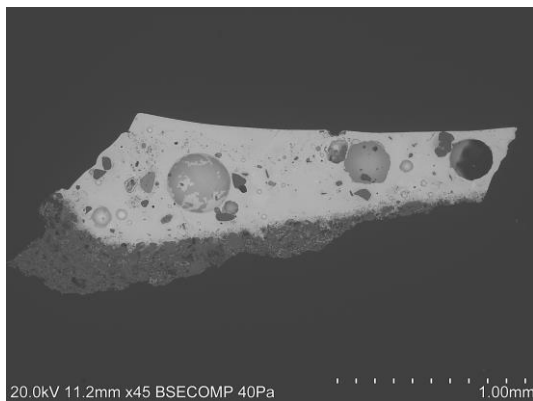


## Equipamento:

Lupa binocular Leica M205 C com câmara acoplada Leica DFC295.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE SEM

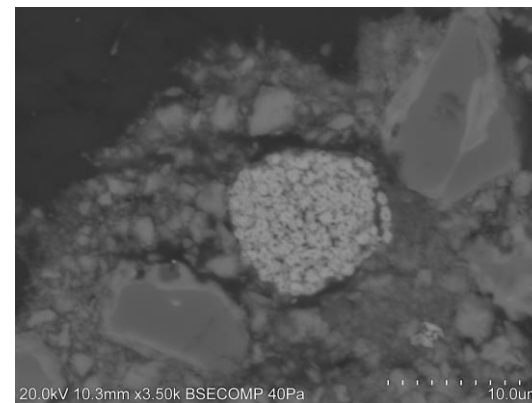
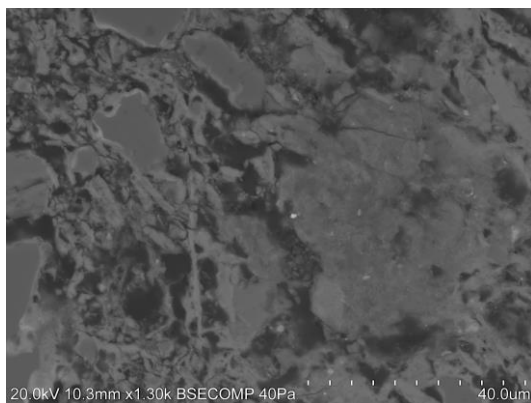


### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA: IMAGENS DE SEM



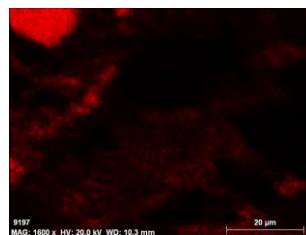
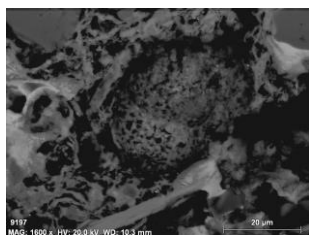
### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

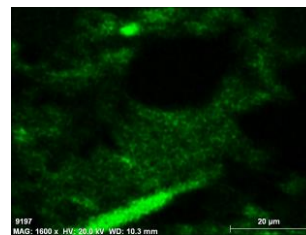
[voltar ao índice](#)



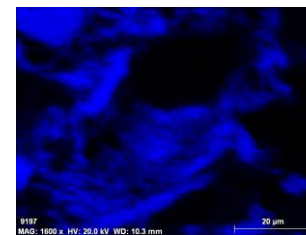
## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS



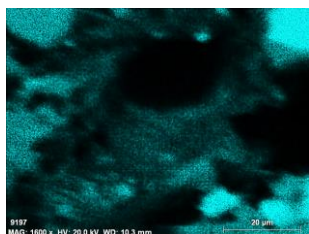
Na



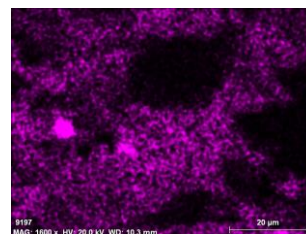
Mg



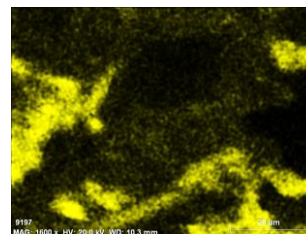
Al



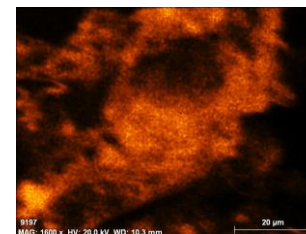
Si



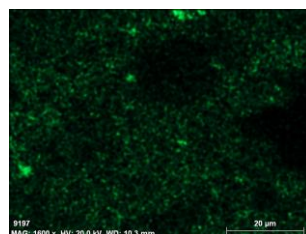
P



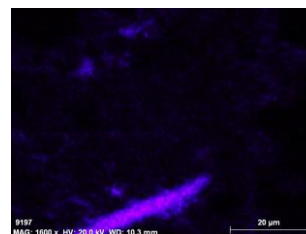
K



Ca



Ti



Fe

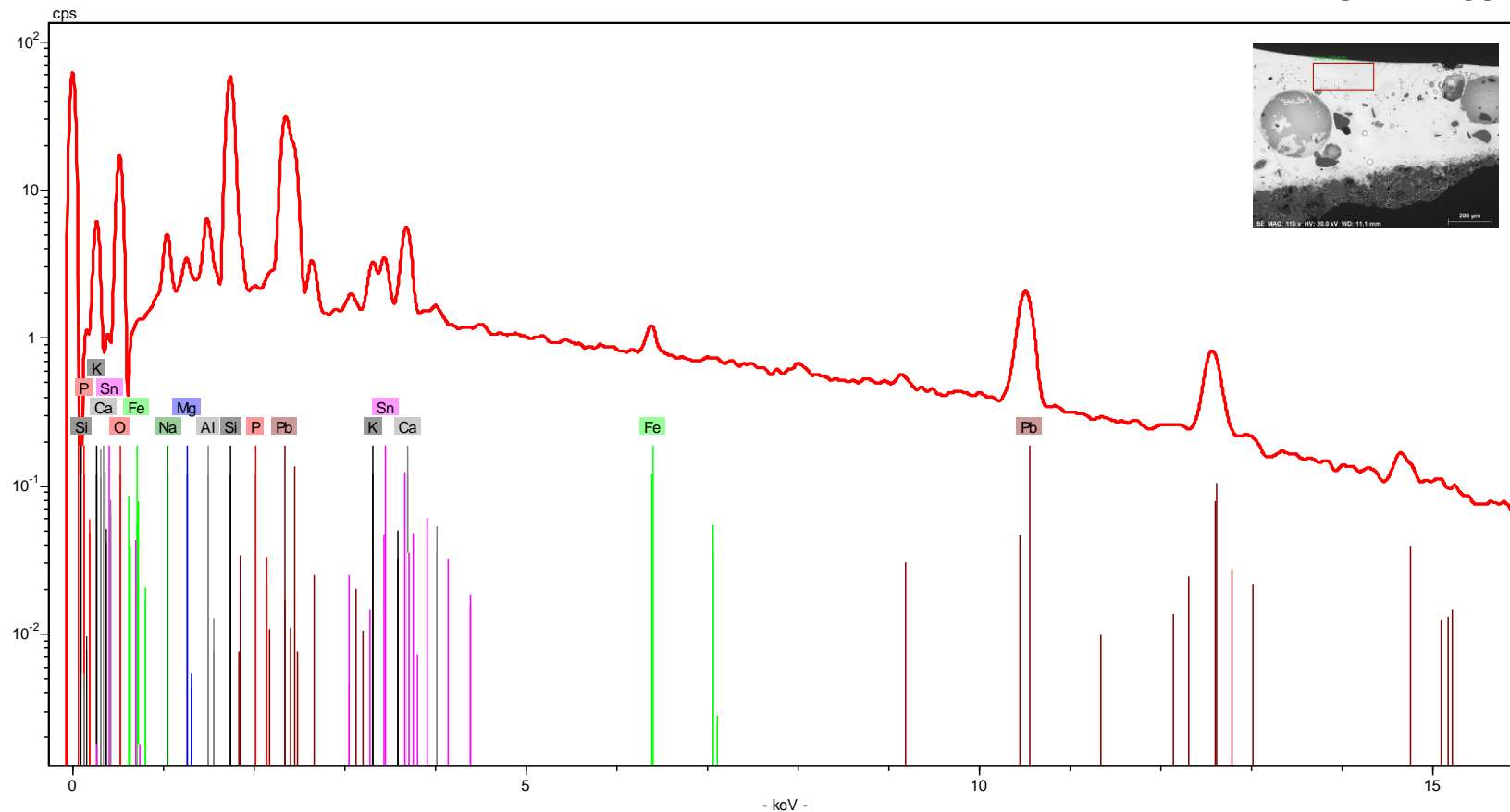
### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

### VIDRADO BRANCO



[AzuRe065 EDS Vidrado.xls](#)

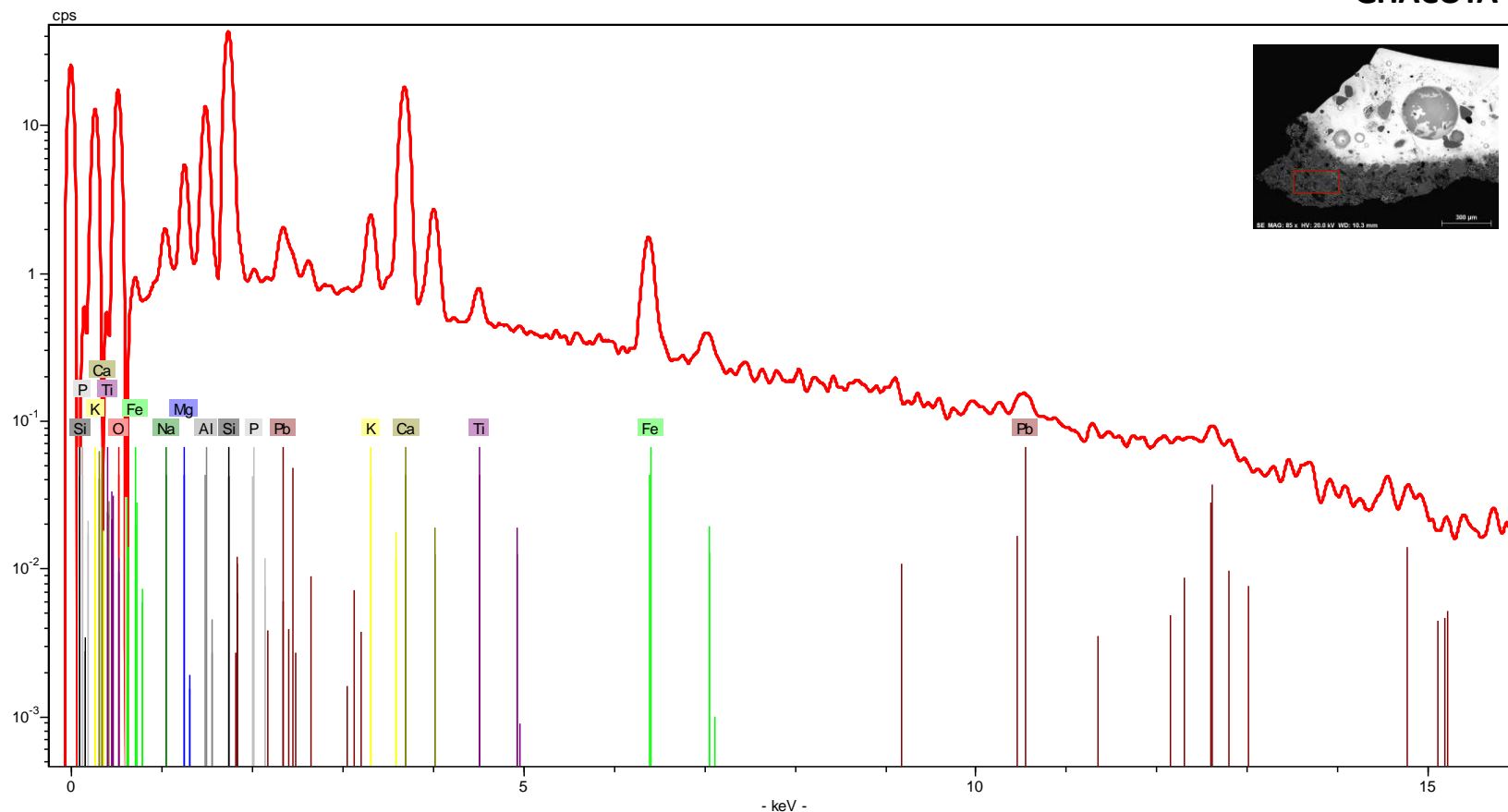
#### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)

## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

CHACOTA



[AzuRe065 EDS Chacota.xls](#)

**Equipamento:**

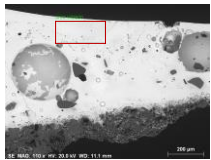

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)



## CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA: ANÁLISE POR SEM/EDS

Composição química (% m/m, normalizada a 100%)\*

Área Analisada	Na	Mg	Al	Si	P	K	Ca	Ti	Fe	Sn	Pb	O
 vidro branco	2,35	0,68	1,52	18,16	(a)	1,01	2,05	--	0,70	1,60	43,51	28,42
 chacota	1,54	3,02	6,95	18,59	(a)	1,67	17,58	(a)	3,85	--	7,33	39,47

\* Os valores apresentados na tabela correspondem às percentagens mássicas dos elementos detetados na amostra ([ver aviso](#)). O teor de oxigénio foi calculado estequiometricamente com base nos [óxidos](#) mais comuns de cada um dos elementos; a) detetado mas não quantificado.

### Equipamento:

Microscópio eletrónico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrómetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

[voltar ao índice](#)